

ナノ粒子の安全性と評価技術シンポジウム

共催：(社) 日本粉体工業技術協会
ナノ粒子の安全性検討委員会
計装測定分科会
微粒子ナノテクノロジー分科会

■ 日 時：平成 20 年 1 月 31 日 (木) 10:00~17:00

■ 場 所：東京・虎ノ門パストラル 新館 5 階 ミモザの間

■ プログラム

I. 午前の部 ナノ粒子の安全性検討委員会報告

- 10:00~10:10 開会挨拶 ナノ粒子安全性検討委員会委員長
愛知学院大学 薬学部 教授 川島 嘉明
- 10:10~11:10 基調講演 「微粒子のリスクに関する規格の動向」
(独) 産業技術総合研究所
化学物質リスク管理研究センター
健康リスク評価チームリーダー 川崎 一 氏
- 11:10~11:40 報 告 「ナノ粒子の安全性：検証と課題」レビュー
ナノ粒子の安全性検討委員会副委員長
東京農工大学大学院 教授 神谷 秀博
- 11:40~12:30 パネルディスカッション「ナノ粒子の安全性：問題点と提言」
司 会 川島 嘉明 (愛知学院大学)
パネラー 小富 正昭 (大塚製薬)、山田 幸良 (日清製粉グループ
本社)、伊崎 文和 (産業技術総合研究所)、遠藤 茂
寿 (産業技術総合研究所)、東谷 公 (京都大学大学
院)、明星 敏彦 (産業医科大学) (以上 予定)
- 12:30~13:30 休 憩 (昼食のお弁当を用意します)

II. 午後の部 製品発表・講演会「ナノ粒子の評価」

- 13:30~13:35 製品発表・講演会開会挨拶
計装測定分科会コーディネータ
京都大学 名誉教授 増田 弘昭
- 13:35~14:20 基調講演 「動的光散乱法によるナノ粒子の計測」
同志社大学 工学部 教授 森 康維 氏
各社製品紹介
- 14:20~14:40 Nanotrac シリーズ (日機装)
- 14:20~15:00 ゼータサイザーナノシリーズ (シスメックス)
- 15:00~15:20 休 憩
- 15:20~15:40 ゼータ電位・粒径測定システム ELS-Z シリーズ (大塚電子)
- 15:40~16:00 高濃度ゼータ電位・粒子サイズ測定装置 AcoustoSizer II
(日本ベル)
- 16:00~16:20 動的光散乱式粒径測定装置 LB-550 (堀場製作所)
- 16:20~16:40 動的光散乱法および超遠心沈降法粒子径測定装置
(ベックマン・コールター)
- 16:40~16:55 質疑応答
- 16:50~17:00 閉会挨拶